Search Notes					

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under Reexamination	
10/573,395	MALEK ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Hien X. Vo	2863	

	SEAR	CHED	
Class	Subclass	Date	Examiner
702	66	1/5/2008 i	VXH
250	281-282		
1	290-291		
	286		
1	288		
			\
			·

INT	INTERFERENCE SEARCHED			
Class	Subclass	Date	Examiner	
	1.			

	DATE	l
		EXMR
Plus	1/3/2008	VXH
East	1/5/2008	VХН
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		